技術情報誌 テクノリッジ Industrial Technology Center of Wakayama Prefecture **TECHNORCIDGE** 2014 304



特集 観察する 〜顕微鏡で観る微小な世界〜





Industrial Technology Center of Wakayama Prefecture TECHNORRIDGE



スギ花粉の SEM 像

2. 巻頭言

3. 光学顕微鏡(マイクロスコープ)

2014 304

- 5. レーザー顕微鏡
- 6. 走查型電子顕微鏡 (SEM)
- 8. 走査型プローブ顕微鏡 (SPM)

「百聞は一見にしかず」といわれるように、私たちは情報の多くを視覚から得ています。 しかし、肉眼で確認できるサイズは 0.1 mm 程度が限界で、それよりも小さなものを見るこ センター とはできません。「目では見えないほどの"小さなモノ"はどのような形をしているのだろ 製品開 う?」といった興味や関心から、顕微鏡という観察のための重要なツールが発明されました。 左上の図はスギ花粉を電子顕微鏡で撮影した写真です。春先に空を舞っている花粉が、こん なコンペイトウのような形をしていることが想像できるでしょうか?目で見ることのできな い世界を観察することは、私たちが普段見ている世界とは異なる新たな発見を与えてくれま 発 で す。 培 顕微鏡の歴史は古く、光学顕微鏡は、16世紀後半にその原形が作られてから現在に至る 品質管理 わ まで、飛躍的な発展を遂げ、細胞や細菌など生物学上の大きな発見をもたらしました。一方、 光学顕微鏡は像の投影に光を使っているために、分解能(拡大しても像がはっきり見える性 れ 能)には原理上の限界がありますが、1930年代に光ではなく電子を利用して像を得る電子顕 た 微鏡が開発されたことにより、1µm 未満のナノオーダーでの物質の観察が可能となりました。 観 また、1980年代に入ると、探針と呼ばれる特殊な針を試料表面に沿って走査させることで像 にお役立てください 察 を得る、走査型プローブ顕微鏡 (SPM) が登場し、1nm 未満の分子・原子オーダーでの観察ま 技 でを可能としています。 種々の原理を利用した顕微鏡が発達したことにより、現在ではヒトの目では確認できな 術 かった微細構造に関する情報を簡単に手に入れることができるようになりました。そして、 を そこから得られるミクロな情報を利用することで、新しい素材の開発や新たな加工技術が生 み出されています。また、製品の製造現場で発生する外観欠損や混入物(異物)などのトラ ブルに対応していく場合にも、目に見えないミクロな領域まで詳細に観察することで原因究 明に繋がるケースが多々あります。 今回のテクノリッジでは「観察する」をテーマに、当センターに設置されている顕微鏡、"光 学顕微鏡 (マイクロスコープ)"、"レーザー顕微鏡"、"走査型電子顕微鏡 (SEM)"、"走査型プロー ブ顕微鏡 (SPM)"の原理や観察事例、活用例を紹介します。センターにて培われた観察技術 を製品開発や品質管理、製造現場のトラブル解決に役立てて頂ければ幸いです。 各種観察方法とその分解能 原子·分子 ウィルス 髪の毛 DNA 大腸菌 ハ 10 mm 100 nm 100 um 目視 光学顕微鏡 編集担当 レーザー顕微鏡 おおさき しゅうすけ 走査型電子顕微鏡(SEM) 大﨑 枩介 走査型プローブ顕微鏡(SPM)

技術紹介

光学顕微鏡(マイクロスコープ)

生活・環境産業部 繊維皮革グループ 宮本 昌幸

光学顕微鏡とは

光学顕微鏡の基本的な構造は、複数の光学レン ズと可視光光源を用いた照明から成り立っていま す。照明光を観察対象に照射し透過する光、観察 対象が反射する光あるいは観察対象が発する蛍光 を、光学レンズにより結像させ、拡大像として観 察する装置です。観察に可視光を用いることから、 光学顕微鏡の分解能の限界(理論上)は100 nm 程 度となります。その一方で、対象物が持つ色情報 を拡大像に反映できることが大きな特徴となりま す。観察には、直接"顕微鏡をのぞく"方法の他に、 カメラ、ビデオなどの撮影機材を用いて画像とす る方法もあります。最近では、CCDやCMOSな どの撮像素子の発展により、デジタル画像での観 察がよく利用されています。さらに、観察のみで なくコンピュータを用いることで画像の処理や解 析が容易に行えるようになってきています。特に、 パソコンに簡易接続できる安価な顕微鏡(マイク ロスコープ)も市販されていることから、光学顕 微鏡は、本特集号に挙げた他の顕微鏡よりも身近 な観察装置ではないかと思います。

繊維材料の拡大観察

衣服などの繊維製品を構成する最小単位は、"細 くて長い"材料、すなわち繊維です。身の回りで 用いられる繊維の太さは、通常直径数十マイクロ メートルで、その形状、形態を肉眼で観察するこ とは困難です。光学顕微鏡は、繊維の形状、形態 を観察するためによく用いられています。また、 繊維製品は、様々な色に着色されていることが多 く、色の違いを拡大下でも観察することができる 光学顕微鏡によっていろいろな情報を得ることも できます。本稿では、光学顕微鏡の利用例として 各種繊維の側面観察と、繊維製品である生地表面 の観察例を紹介します。

天然繊維と化学繊維

図1には、各種繊維の側面を透過光により観察 した拡大像を示しました。まず、繊維の種類によっ て形態が大きく異なることがわかっていただける と思います。このような顕微鏡による拡大観察か ら得られる情報は、繊維鑑別方法を規定したJI Sにも各種繊維の顕微鏡的外観の特徴として挙げ られています。

図1 (a) および (b) は綿とレーヨンの拡大画像 です。綿は、ワタの種子から取れる天然繊維で、 扁平で捩れた形態 (天然より)をしています。レー ヨンは、パルプを原料として湿式紡糸という技術 により製造される化学繊維です。繊維の軸方向に 数本のすじがはしった形態が観察されます。両繊 維は、セルロースから構成されていることから、 化学分析や化学物性に基づく手法では判別が困難 なもの同士ですが、拡大観察ではその形態から明 確に見分けることができます。

図1(c)は、動物由来の天然繊維である毛(羊毛)の拡大像です。人間の髪の毛の表面にキューティクルと呼ばれるウロコ状のものが存在することは、シャンプーの広告などでよく目にすることと思います。羊毛にも毛髪と同様にキューティクルが存在し、拡大観察時には毛と他の繊維を見分ける大きな手がかりとなります。また、毛のキューティクルの形状と太さを詳細に調べれば、その毛の起源となった動物を特定することも不可能ではありません。

図1 (d) および (e) にはポリエステルとナイロ ンの拡大像を示しました。両繊維とも溶融紡糸と いう手法で製造されており、通常、円柱状の形状 をしています。そのため図のように、拡大像も滑



技術紹介

光学顕微鏡(マイクロスコープ)

らかで均一な側面形態が観察され、拡大観察だけ ではこれらを見分けることは困難です。これらの 繊維の判別には、化学分析や化学物性に基づく手 法が有効です。

織物と編物

図2は反射光による生地表面の観察例を示して います。先に説明した繊維を引き揃えて撚り合わ せると、糸になります。この糸を平面的に組み合 わせると生地(布)が形成されます。同じ生地でも、 図2(a)と(b)では糸の組み合わされている様子 が異なっています。図2(a)では、たて方向の糸 とよこ方向の糸が直交しているのが確認できます。 このような生地は織物と呼ばれ、糸が直交してい るため型くずれしにくい特徴があります。一方、 図2(b)では糸が繰り返しループを形成していま す。この生地は糸がよこ方向に走っていることか らよこ編みと呼ばれる編物です。編物はループで できているため、伸び縮みしやすくしわになりに くいという特徴があります。

図3は、和歌山県工業技術センターにて開発された柄出し編物の観察例を示しています。柄出し 編物は、異なる給糸張力で複数の糸を編機に供給 することで、編目の違いを生じさせ、生地の柄と しています。図3(a)の明るく見える柄の部分を 拡大したものが図3(b)です。ここでは、赤糸と 白糸が均一に現れているのが確認できます。一方、 暗く見える部分を拡大した図3(c)では、白糸の 現れる部分が赤糸の現れる部分に比べて少なく なっています。このように、拡大観察により目視 で見えている生地の柄が網目の違いにより生じて いることが確認できました。

生地上の異物の観察

図4には黒点が多数認められる綿の編物生地(図

4 (a)) とその黒点の生地上での低倍率での拡大観
 察像(図4 (b))、それを採取し透過光によってさらに高倍率で観察した画像(図4 (c))を示しました。

まず、低倍率の観察から、黒点は、何らかの汚 れが糸に染み付いているのではなく、黒色の固形 物が付着していることがわかります。高倍率の観 察からは、黒色固形物はセル状のものが集まった 形態をしていることがわかります。さらにそこか ら多数の繊維状のものが生えていることが観察で きます。この繊維状のものの形態は綿と非常によ く似ています(図1(a)と比較してみてください)。 以上の観察結果と綿繊維がワタの種子の表皮細胞 が伸長生長したものであることを考え合わせると、 この黒点は、綿繊維に混入したワタの種子の表皮 であり、繊維とともに糸に紡績され、さらに編成 されて、生地表面に存在しているものであると推 定できます。

本来、ワタの種子の表皮は、糸に紡績される際 に除かれたり、精練・漂白によって除去あるいは 目立たなくなるものですが、例に挙げた生地の場 合は、いずれかの工程の一部の処理が十分に行わ れなかったのではないかと推測できます。

さいごに

光学顕微鏡の使用例として、繊維分野での観察 例を紹介しました。光学顕微鏡観察は繊維分野に 特化したものではなく、当然他の産業分野の品質 管理等でも利用可能です。トラブル発生時等に問 題箇所を拡大観察するのであれば、まず光学顕微 鏡を利用されることをお勧めします。和歌山県工 業技術センターには、用途、対象物に応じた様々 な光学顕微鏡を保有しておりますので、どうぞご 相談ください。



レーザー顕微鏡

化学産業部 合成技術グループ 森 岳志

レーザー顕微鏡とは

レーザー光を試料に照射し、そこから得られる 反射光を検出し像として表示させます。レーザー 顕微鏡の最大の特徴は、凹凸のある試料にレーザー 光を走査することで、非接触で簡便にその立体的 な形状を観察できる点にあります。そして、得ら れた形状像から、高さ、うねり、粗さなどの測定 も可能です。このような観察ができるのは、光学 顕微鏡にはない、焦点が合う位置の光だけが検出 器に達する共焦点光学系を利用しているためです。 そのため、高さ方向の分解能が非常に良くなり、 立体形状を再現できるというわけです。

測定できる分解能は、レーザー光のスポット径 や検出器の種類や光学系の精度にもよりますが、 数百ナノオーダーの形状を観察することも可能で す。像の分解能としては、光学顕微鏡と電子顕微 鏡の間になるでしょう。ただし、ミリオーダーの 形状像を得るのであれば光学顕微鏡でも十分です。 もし数百ナノオーダーでの観察が必要で、高真空 下では測定困難な試料の場合は、立体形状を測定 できるレーザー顕微鏡の利用が最適です。本稿で は、異なる試料を例に挙げ、レーザー顕微鏡の有 用性を説明します。

高精細な立体画像

ではどの程度高精細な画像を観察できるので しょうか?図1(a)では樹脂基板上に印刷した導電 ペーストの形状像を示しています。ペーストの金 属粒子のサイズは数百ナノ程度ですので、はっき りと粒子形状を得ることはできませんが、細かな 粒子の集まりであることは像から読み取れます。 この印刷されたインクの高さを測定してみると、 2.6~4.6 µm であることが分かりました。測定箇 所により高さが違うので、等高線を用いた 3D 表示 にすると、線の高さは均一ではなく、少し波打っ ている状態がはっきりとわかります(図1 (b))。 この形状像を得るのに要した時間は、高さ方向 の走査範囲を指定することを含めても1分程度で す。このように微小な領域の立体形状を簡便に測 定することができます。

様々な試料の測定

光学顕微鏡では、ガラス、樹脂フィルム、塗膜 などを対象とした場合、透明であったり、強く反 射してしまうものは、その表面の細かな傷やうね りなどを形状像として得ることは容易ではありま せん。また、高真空下に置けないウェット状のも のは電子顕微鏡で観察することはできませんが、 レーザー顕微鏡では、試料状態の制限が少なく、 図1(a)からわかるように、樹脂基板の表面の細か な凹凸が観察できています。

図2では、コピー用紙を光学顕微鏡とレーザー 顕微鏡で観察したものを比較しています。光学顕 微鏡では、繊維からの反射もしくは蛍光が強いた め、コントラストが悪く、高さ方向に走査しても 明瞭な形状像が得られません。一方、レーザー顕 微鏡では、密に絡み合った繊維がはっきりと観察 できています。図3では紙に固形糊を塗った直後 と乾いた後の表面を示しています。こうしたやわ らかい試料でも非接触での測定のため、表面を傷 つけることなく形状の情報を得ることが可能とな ります。その他、特殊なレンズを使用することで 液中の測定や、10 cm 程度の距離の線粗さ(段差) 測定も可能です。

このように、多種多様なサンプルの細かな形状 を簡便に知ることができるため、「光学顕微鏡では 見えないから、電子顕微鏡で見てみようか」とい う前に、一度レーザー顕微鏡で確認してみると意 外と十分な情報が得られるかもしれません。

[謝辞] 基板試料をご提供いただいた新中村化学 工業株式会社に感謝いたします。



走 查型電子顕微鏡 (SEM)

化学産業部 分析評価グループ 大崎 秀介

電子顕微鏡とは

前ページで紹介した光学(レーザー)顕微鏡が 「光」によりモノを見るのに対して、電子顕微鏡は 「電子線」を用いて観察します。光学(レーザー) 顕微鏡の分解能は、可視光線の波長によって理論 的に 100 ナノメートル程度が限界ですが、電子顕 微鏡では、電子線の波長が可視光線よりもずっと 短いので、理論的には分解能は 0.1 ナノメートル 程度になります。そのため、光学顕微鏡のように カラフルではありませんが、光学顕微鏡では確認 できない微細な構造まで観察することが可能とな ります。

電子顕微鏡は、観察対象に電子線を照射し、発 生した電子を検出して像として表示する"走査型 電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope; SEM)" と、観察対象に電子線を照射し、対象を透過して きた電子により得られる像を観察する"透過型電 子 顕 微 鏡 (Transmission Electron Microscope; TEM)"に大別されます。本稿では、弊所に設置さ れている走査型電子顕微鏡 (SEM)を中心に、その 観察事例を紹介します。

走査型電子顕微鏡(SEM)で見える像

図1に示すように、試料に照射された電子は 試料表面で反射されるか、散乱しながら吸収さ れ、様々な形のエネルギーとして放出されます。 試料表面で発生する二次電子や反射電子の強度 は、試料の凹凸や元素の違いにより異なります。 そのため、照射する電子線を観察面に対して走 査し、二次電子や反射電子を検出することで、 試料の形状や元素組成に応じた像を得ることが できます。図1にある特性X線は、試料の元素 分析をおこなう際に利用するもので、詳細につ いては TECHNORIDGE 297 号 を参照してくださ い。

前ページのレーザー顕微鏡にて観察した導電 ペーストと同一試料を、SEM を用いて観察しま した(図2)。レーザー顕微鏡を用いた観察像で は、ライン上の微細構造の詳細までは判断でき ませんでしたが、SEM ではペースト中に含まれ る金属粒子(銀)の様子まで鮮明に判別できて おり、それら粒子がサブミクロンサイズである ことが確認できました。

電界放出型電子顕微鏡(FE-SEM)

電子顕微鏡において電子線を発生させる電子銃 は、熱電子放出型と電界放出型(Field Emission; FE)に分類されます。FE 型電子銃は、鋭く尖らせ たチップの先端に強い電界を作用させて電子を放 出します。熱電子放出型よりも光源のサイズが小 さくビームを細く絞れるため、高分解能での観察 が可能となります。実際、熱電子放出型の汎用 SEM では鮮明な画像を得ることが難しい、100 nm 以下の微細構造も鮮明に観察することが可能です。

図3,4にはFE-SEMを用いて観察した炭酸カル シウムの微粒子と色素増感太陽電池に用いられる 透明電極基板上に成長させた酸化亜鉛の結晶をそ れぞれ示しています。炭酸カルシウムの微粒子は 約 20µm 程度の粒径ですが、この粒子はさらに小 さな粒子(一次粒子)が集まることで形成された



走查型電子顕微鏡(SEM)

二次粒子です。図3(a)にあるように7,000倍程 度の倍率では、この微粒子が二次粒子であること を判断できませんが、50,000(図3(b))、100,000 (図3(c))倍と高倍率で観察することで、100 nm 前後の一次粒子の集合体であることが分かります。

また、色素増感太陽電池の電極基板は、基板表 面をどれだけ細かな結晶で密に覆うかが性能を左 右します。そのため、その微細構造をナノスケー ルで評価する必要があります。図4では、電極基 板上に作製した酸化亜鉛が基板に対して垂直方向 にキレイに成長しており、各結晶が 100 nm 未満の 柱状結晶として基板表面を密に覆っていることが 確認できます。

このように、FE-SEMを用いることで、ナノスケー ルで制御された材料の微細構造まで評価すること が可能となります。

FE-SEM を用いた透過法による観察

先に述べたように、SEM での観察では試料表面 から発生した電子を観察するのが通常ですが、TEM と同じように透過した電子線が観察可能な装置も あります。図5に TEM 用に試料調製をおこなった 粒子経約 10 nm の銀ナノ粒子の走査透過像による 観察例を示します。試料を透過した電子を検出し ているため、SEM 像とは白黒が反転し測定対象は 影のように見えていますが、その粒子径が 10nm 程 度であることが確認できます。

観察における注意点

電子顕微鏡を用いることで、非常に高倍率まで 試料観察が可能となりますが、測定には幾つか注 意点があります。安定した電子線を照射するため





図3 炭酸カルシウムの微粒子

に顕微鏡内は高真空に保たれているので、測定試 料は完全に乾燥された状態である必要があります。 また、観察対象に導電性が無い場合、電子線をあ て続けると表面が帯電してしまい、像が白く浮き 上がってしまいます(チャージアップ)。そのため、 その表面にあらかじめ導電性を持つ物質(金など) を薄く蒸着する必要があります。このチャージアッ プについては、測定雰囲気を低真空にして観察す る方法や、FE-SEM の場合は放出する電子線の加速 電圧を調整することで対処することも可能です。

さいごに

今回紹介した SEM (FE-SEM) を用いた観察例は 全て弊所に設置されている装置にて撮影されたも のです。昨年度末に FE-SEM が導入され、これまで 対応ができなかったナノオーダーでの試料評価が 可能となり、皆様の製品開発、品質管理等でお役 に立てることがあるかと思います。ご興味をもた れた方は、是非ご利用いただければ幸いです。

[謝辞]炭酸カルシウム微粒子をご提供いただいた三木理研工業株式会社、銀ナノ粒子をご提供いただいた紀州技研工業株式会社に感謝いたします。





図5 銀ナノ粒子の透過像 WINTEC TECHNORIDGE 304 (2014) 7

1 CHNORIDGE 304 (2014

編集・発行/ 和歌山市小倉60番地/和歌山県工業技術センタ・テクノリッジ

発行日/201 A E L / 073 - 4777 -4年8月29 -4年8月29 7 2 2 2 1 日 8 2 8 7 0 1

T 住印 E 所刷 L//

15

刷所

100

Т

技術紹介

走査型プローブ顕微鏡(SPM)~AFMモードによる形状測定~

機械金属グループ 機械金属産業部 時枝 健太郎

走査型プローブ顕微鏡とは?

走査型プローブ顕微鏡(Scanning Probe Microsc ope; SPM) は、観察するものに探針 (プローブ) を近づけて走査しながら「何か」を検出し画像化 する顕微鏡の総称です。「何か」は、探針と試料間 の物理的相互作用であり、原子間力、電磁気力や 摩擦力など様々なものがあります。本稿では、SPM の最も基本的な測定モードである原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope; AFM) としての使い方 を紹介します。AFM は、電子顕微鏡と同等かそれ以 上に微小な領域(原子オーダーまで)の表面形状を、 レーザー顕微鏡のように3次元で観察できます。

AFM の基本動作(図1)は、微小な板バネの先端 につけた極めて鋭い探針を用いて、探針と試料の 原子間に働く力(原子間力)を一定に保つ、すな わち板バネのたわみや振れを一定に保つように探 針と試料間の距離を制御しながら、試料表面上を 走査します。この距離の制御値に基づいた凹凸情 報をマッピングすることで高精度の三次元形状像 を得ています。

AFM は、原子間力があらゆる物質に働くため、「試 料を選ばず」、導電性の試料だけでなく絶縁物の観 察も行うことができます。また、「測定環境を選ば ず」、大気中だけでなく、真空中や溶液中、温度を 制御した状態など様々な環境下で観察できること も大きな特長です。

銀ナノ粒子インクの形状観察

電子回路等を印刷によって作製するプリンテッ ドエレクトロニクス技術に用いられる銀ナノ粒子 インクを題材として、AFM の特長を活かした表面形 状観察を行いました。

銀ナノ粒子インクは、ナノ粒子を有機物である 保護基で覆うことで安定した分散状態を保ち、微 細印刷性を得ています。しかし、印刷しただけで は保護基が邪魔をして導電性が悪いため、加熱に より保護基を熱分解してナノ粒子を凝集させる「焼 成」がおこなわれ、良好な導電性を持つ配線や電 極となります。

図2は、銅板上に印刷して乾燥させた銀ナノ粒 子インクの AFM による観察像です。 粒径 20 nm 程 度の粒子が均一に分布しており表面の凹凸が 20 nm 以内であることが分かります。この状態のインク は導電性がほとんど無いため、電子顕微鏡を用い た観察の場合には金スパッタ等の導電性付与が必 要ですが、AFMではそのまま観察できます。

次に、この試料を加熱し、250℃までの各温度に 保持した状態を AFM により観察しました (図3)。 25℃では粒径 20 nm 程度の粒子が密集しており、 100℃では数十~ 100 nm 程度の大きさの塊が連な り、150℃では 500 nm 角の視野全体に広がった島 状の構造を示しました。そして、250℃では島同士 の繋がりが滑らかになっていることが分かります。 試料の熱膨張のため、同一部位の加熱による変化 を追跡することはできなかったのですが、銀ナノ 粒子が凝集していく過程を明瞭に捉えることがで きました。

当センターの走査型プローブ顕微鏡は、上記の ように様々な試料の形状観察を -120℃~ 300℃の 温度制御下で行うことができます。ご活用下さい。

[謝辞]銀ナノ粒子インクをご提供いただいた紀州 技研工業株式会社に感謝いたします。



25℃

150℃

物理的相互作用! 変位センサ - (0.01nmの動きを検知) 非常に柔らかい板バネ (10⁻¹⁰Nのカでも極微小量たわむ) 探針 (プローブ) (先端半径は10nm程度) ガ 走査精度:平面 0.1nm 高さ 0.01nm 図1 AFM の動作概略図 [ատ] 150

印刷された銀ナノ粒子インクの表面形状 3D 表示 図 2

[nm]

印刷された銀ナノ粒子インクにおける加熱による表面形状の変化 図3